Author Index

A

Agarwala, V. V., 382
Agrawal, A. K., 394
Anderko, A., 241
Andersen, G. A., 458

B

Bakker, A., 303
Bayle, B., 343
Brongers, M. P. H., 394

C

Cameron, J., 363
Chou, P. H., 352
Cragnolino, G. A., 273

D

Dean, S. W., 429
De Curiere, I., 343
Devine, T. M., 352
Deydier, D., 210
Dietzel, W., 317
Dunn, D. S., 241, 273

E

Ellis, P. F., II, 363
Engelhardt, G. R., 166
Etien, R., 352

F

Fujimoto, K., 224

G

Gangloff, R. P., 104
George, K., 382

I

Iwamura, T., 224

J

Jones, R. H., 259

K

Kaji, Y., 191
Kane, R. D., 429
Kharin, V., 329
Koch, G. H., 394
Koers, R. W. J., 303
Krom, A. H. M., 303

L

Lee, E. U., 382

M

Macdonald, D. D., 166
Magnin, T., 343
Maldonado, J. G., 429
Maldonado, L., 411
Meunier, M.-C., 210
Miwa, Y., 191
Munson, R. E., 363

N

Nakajima, H., 191
Nishida, S., 224

O

Ovejero, E., 444

P

Pan, Y.-M., 273

R

Raicheff, R., 411
Rebak, R. B., 289
Revie, R. W., 473
Richey, E., III, 104

Copyright© 2000 by ASTM International www.astm.org

S

Sanders, H. C., 382
Scott, P. M., 210
Scully, J. R., 40
Shen, G., 473
Silvestre, S., 210
Sofronis, P., 70
Sridhar, N., 241
Staehle, R. W., 131
Sutherby, R., 473

T

Taha, A., 70
Toribio, J., 329, 444
Trenty, A., 210
Tsuji, H., 191
Tsukada, T., 191
Turnbull, A., 23
Tyson, W. R., 473

W

Wei, R. P., 3

Y

Yonezawa, T., 224

Z

Zheng, W., 473